

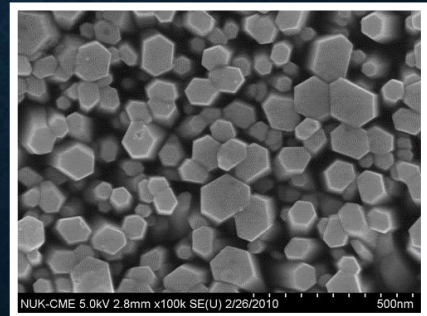
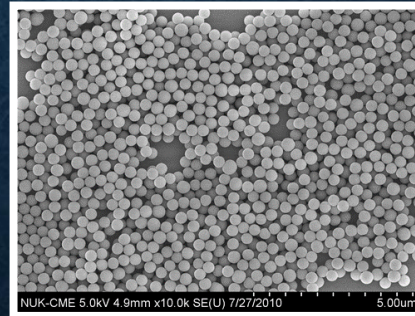
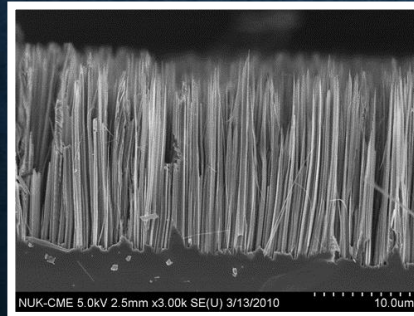
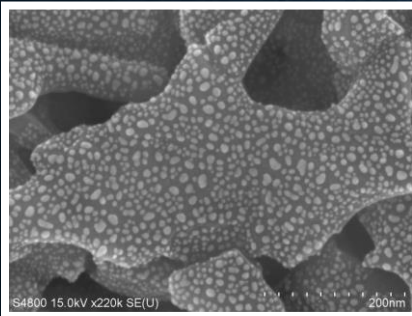
場發射掃描式電子顯微鏡 (FESEM)

-性能說明&成果圖片



存置地地點：綜合大樓110-1室

廠牌/型號	Hitachi / S-4800
重要規格	<ol style="list-style-type: none"> 解析度: <ul style="list-style-type: none"> (a) ≤ 1.0 nm (加速電壓: 15 Kv, 工作距離 ≥ 4 mm時) (b) ≤ 1.4 nm (加速電壓: 1 Kv, 工作距離 ≥ 1.5 mm時) 放大倍率: 20~ 800,000倍 加速電壓: 0.1KV ~ 30KV 電流: ~pA~ 200nA 電子源: 冷場發射電子源 試片規格: 直徑 ≤ 150 mm 高度 ≤ 10 mm 試片載台: 試片移動範圍如下: <ul style="list-style-type: none"> X-axis: 0~110 mm Y-axis: 0~110 mm Z axis: 1.5 mm~ 40mm Rotation: 0~ 360° Tilt: > -5 ~ +70°
廠牌/型號	Bruker QUANTAX SDD (XFlash® 5030)
重要規格	<ol style="list-style-type: none"> 解析度: 127 eV Activated area of Detector: 30mm²



奈米物性量測平台(AFM/RAMAN)

-性能說明&成果圖片



存置地點：綜合大樓110-1室

廠牌/型號	NT-MDT Service& Logistics Ltd. / NT-MDT NTFGRA Spectra
重要規格 (AFM)	<ol style="list-style-type: none"> 可操作功能有： <ol style="list-style-type: none"> (1) SPM mode:一般AFM (2) Heating mode:加熱 (3) Liquid mode:液相 (4) STM mode:穿隧電流 (5) Lithography mode:蝕刻 試片規格： 直徑$\leq 40\text{mm}$、高度$\leq 15\text{mm}$、重量≤ 100，不適用 高分子或軟性材料
重要規格 (Raman)	<ol style="list-style-type: none"> 激發雷射光源：532 nm 試片規格： 不透光、直徑$\leq 40\text{mm}$、高度$\leq 15\text{mm}$ 重量$\leq 100\text{g}$ 掃瞄範圍：90 x 90 x 9 μm

